

## PROGRAMME

### Jeudi 21 juin 2018

08:30 Accueil des participants

09:00 **Début de la formation** (pour les participants inscrits)

*Découverte des techniques de caractérisations physico-chimiques des surfaces et interfaces dans les matériaux.*

**Visite des laboratoires ouverte à tous : TESCAN ANALYTICS, POLYMEX, TERA Environnement**

12:00 Déjeuner

13:30 Bienvenue

#### SESSION 1 : NETTOYAGE / PROPRETE DE SURFACE

13:30 **Evaluation de procédés de décontamination adaptés aux grandes structures optiques**

D. Cheung<sup>1</sup>, D. Faye<sup>2</sup> – Présentée par S. Gigout

<sup>1</sup>Entegris Cleaning Process - Montpellier (France), <sup>2</sup>CNES - Toulouse (France)

14:00 **Résistance électrique de contact - mesure et application au choix et au contrôle des matériaux pour la connexion électrique**

P. Laurat

LEGRAND - Limoges (France)

#### SESSION 2 : IMAGERIE CHIMIQUE

14:30 **L'apport des techniques SIMS dans la construction des claims des produits de soin capillaire**

C. Mazilier

L'ORÉAL R&I - Saint-Ouen (France)

15:00 **Micro et nano-tomographie RX en laboratoire : imagerie 3D multi-échelles appliquée à l'évaluation de l'impact environnemental des nanotechnologies**

N. Bossa, P. Chaurand, D. Borschneck, V. Vidal, C. Levard, J. Rose

CEREGE - Aix En Provence (France)

15:30 **ToF-SIMS : Apport des cartographies chimiques et du canon clusters d'argon**

L. Dupuy, Y. De Puydt, J. Raujol

TESCAN ANALYTICS - Fuveau (France)

16:00 **Pause-Café**

#### SESSION 3 : DERNIERES INNOVATIONS EN INSTRUMENTATION

16:30 **Applications in Atom Probe Tomography**

A. Bui<sup>1</sup>, D.A. Reinhard<sup>2</sup>, R.M. Ulfing<sup>2</sup>

<sup>1</sup>CAMECA CS, Gennevilliers (France), <sup>2</sup>CAMECA Instruments, Inc., Fitchburg (USA)

17:00 **Quelle technique choisir pour obtenir des données métrologiques entre les différentes solutions d'analyses surfaciques, par technologie de contact ou optique, sur vos échantillons ? Quelles normes prendre en compte ? Quelles perspectives ?**

J. Beaumale

BRUKER, Champs sur Marne (France)

17:30 **Latest developments in 2D and 3D TOF-SIMS analysis**

M. Kleine-boyman

IONTOF GmbH - Münster (Allemagne)

18:00 **Introduction des techniques de micronalyses et accessoires innovants intégrés au MEB-FIB TESCAN**

D. Barresi

TESCAN FRANCE - Fuveau (France)

18:30 **Echanges avec les partenaires/exposants**

20:00 **Dîner**

## PROGRAMME

### Vendredi 22 juin 2018

#### SESSION 4 : COUCHES MINCES & MULTICOUCHES

- 08:30 **Micro-source d'ions ECR pour la production de faisceaux à hautes brillances et pour le traitement des surfaces : nouvelles approches mono ou multi-faisceau**  
P. Sortais  
*Polygon Physics, Grenoble (France)*
- 09:00 **Delayering of 14 nm chip by means of GIS-assisted Xe Plasma FIB etching**  
O. Jozef<sup>1</sup>, G. Goupil, D. Barresi<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>TESCAN FRANCE - Fuveau (Tchèque, république), <sup>2</sup>TESCAN FRANCE - Fuveau (France)
- 09:30 **Optical characterization of 2D materials using quantitative phase microscopy**  
S. Khadir, S. Monneret, G. Baffou  
*Institut Fresnel, CNRS, Aix Marseille Univ, Centrale Marseille, Marseille (France)*
- 10:00 **ColdFIB – FIB avec une nouvelle source d'ions à partir d'atomes refroidis par laser**  
M. Viteau, M. Reveillard, A. Delobbe, A. Houel, D. Comparat  
*Orsay Physics - Fuveau (France)*
- 10:30 **Pause-Café**

#### SESSION 5 : INTERFACES DANS LES COMPOSITES

- 11:00 **Caractérisation des propriétés physico-chimiques et mécaniques et des forces d'interaction de surface et d'interfaces des matériaux composites utilisés pour en propulsion**  
G. Lacroix<sup>1</sup>, Y. De Puydt<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>ARIANEGROUP, Les Mureaux (France), <sup>2</sup>TESCAN ANALYTICS, Fuveau (France)
- 11:30 **Quelques exemples de l'apport de la caractérisation locale des interphases pour le développement des matériaux composites : composites intelligents – vieillissement des composites**  
P. Carriere, L. Belec, A. Fahs, J.F. Chailan  
*Laboratoire MAPIEM - Université de Toulon - La Garde (France)*
- 12:00 **Revêtement Hybride pour la protection de matériaux composites**  
N. Donnat.  
*EXPIRIS - Marignane (France)*

### 12:30 Déjeuner

#### SESSION 6 : PACKAGING

- 14:00 **Etude de la contamination de matériels sensibles du spatial par les matériaux d'emballage**  
D. Faye<sup>1</sup>, D. Cheung<sup>2</sup> - Présentée par H. Zschiedrich  
<sup>1</sup>CNES - Toulouse (France), <sup>2</sup>Entegris Cleaning Process - Montpellier (France)

## PROGRAMME

...Vendredi 22 juin 2018

### SESSION 7 : TRAITEMENTS DE SURFACE

- 14:30 **Le traitement de surface par décharge électrique Corona ou Plasma : Solutions innovantes pour gagner en qualité et en rentabilité**  
N. Seninck  
STTS, Systèmes et Technologies de Traitement de Surface, La Ferté S/Chiers, France
- 15:00 **Surface functionalization by USP laser texturing**  
L. Gemini, G. Mincuzzi, M. Faucon, R. Kling  
ALPhANOV - Talence (France)
- 15:30 **Atmospheric plasma treatment of polymer films: correlation between surface properties and chemical nature of surface grafting and multilayer coating**  
E. Gat<sup>1</sup>, Y. De Puydt<sup>2</sup>, N. Vandencastele<sup>1</sup>, V. Dimeo<sup>1</sup>, J. Viard<sup>1</sup>, C. Roukoss<sup>2</sup>, L. Dupuy<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>Coating Plasma Innovation - Fuveau (France), <sup>2</sup>TESCAN ANALYTICS - Fuveau (France)
- 16:00 **Rôle du flammage et de l'injection d'un Polypropylène formulé sur l'adhérence d'une peinture**  
F. Georgi  
MINES ParisTech, PSL Research University CEMEF - Centre de Mise en Forme des Matériaux, UMR CNRS 7635 - Sophia Antipolis (France)
- 16:30 **CLOTURE**
- 16:30 **Visite des laboratoires ouverte à tous : TESCOAN ANALYTICS, POLYMEX, TERA Environnement**

\*\*\*\*\*

### EXPOSANTS/SPONSORS



### PARTENAIRES FONDATEURS



### PARTENAIRE

